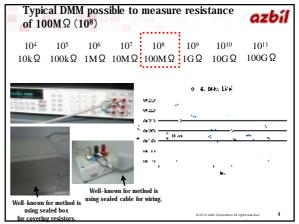
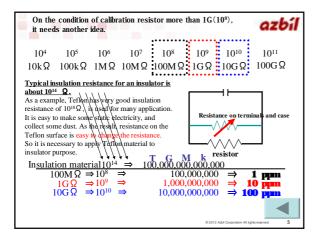
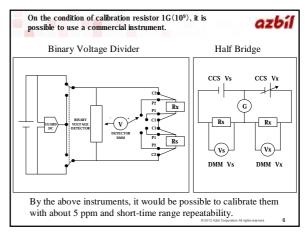
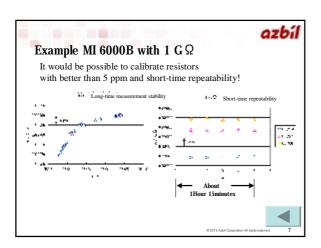


 \mid On the condition that calibrating resistor is more than 10 GQ, the task needs many attentions and it is not easy to judge the resistance value adequate one. The information for standard resistor is poor.

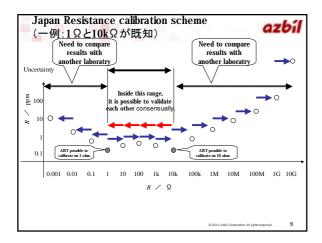


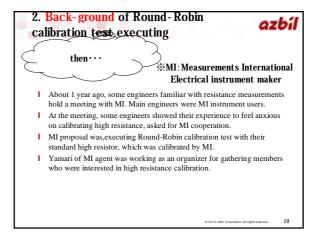




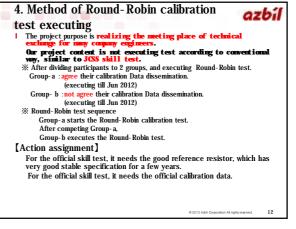


不確かさの要因	感度 係数	1GΩ 1101052 MO	1GΩ 1101371 MO	10G Ω 1102185 MO	10G Ω 1102186 MO
振歩にかかる不確かさ 標準抵抗器の校正の不確かさ	H or Rx ² /H/Rlo ²	0.0065	0.0065	0.7150	0.7150
****1810年のほどの11年200 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$-Rx^2/Rh^2$	0.0005	0.0005	-0.8500	-0.8500
温度変化による抵抗値の変化	H or Rx ² /H/Rlo ²	0.0029	0.0029	0.3175	0.3175
ラレル測定時の温度変化による標準抵抗器HI側の変化	-Rx ² /Rhi ²			-0.1786	-0.1786
標準抵抗器の経年変化	H or Rx ² /H/Rlo ²	0.0012	0.0012	0.1270	0.1270
「ラレル測定時の標準抵抗器HI側の経年変化」	-Rx ² /Rhi ²			-0.2887	-0.2887
標準抵抗器の電圧特性 パラレル測定時の標準抵抗器取倒の電圧特性	H or Rx ² /H/Rlo ² -Rx ² /Rhi ²	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Anderの抵抗比測定の不確かさ	-Kx/Km Rref or $Rx^2/H^2/Rlo$	0.0014	0.0014	0.6351	0.0000
Ridgeの直線性の不確かさ	Ref or $Rx/H/Rio$ Ref or $Rx^2/H^2/Rio$	0.0000	0.0000	0.0003	0.0003
『単器において考慮しなければならないその他の影響		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
寄生熟起電力の影響	Rref or Rx ² /H ² /Rlo	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
/イズレベルの影響 (定環道において老歯) なければならないその他の影響	1	0.0003	0.0003	0.1328	0.0361
被検正要にかかる不確かさ				-	
5抗値の校正結果のパラツキ	1	0.0030	0.0028	0.1834	0.0525
な正環境で校正対象が受ける温度の影響 ド正対象において考慮しなければならないその他の影響	Rx	0.0042	0.0036	0.2664	0.2323
	合成標準不確かさ (MΩ 自由度	0.0090	0.0086	1.4112	1.3883
	自田度 包含係数	496	530	24553 1.96	196
	拡張不確かさ(MO)	0.0176	0.0170	2 7660	2,7205

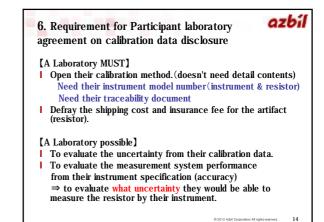


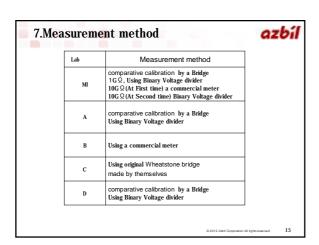


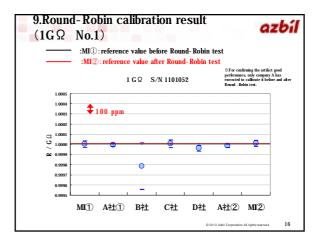


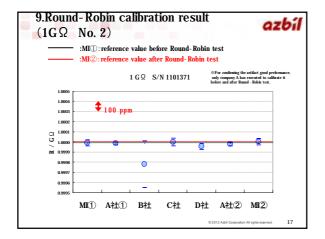


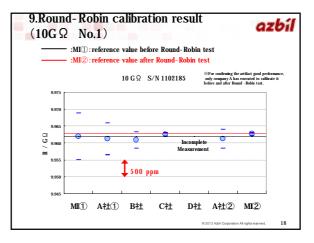
Group	Data dissemination	Round-Robin method	Period	Fee	Requirement for Activity Participation	Requirement for Meeting Participation
Group-a	Agree	After setting MI calibration data as reference. executing Round- Robin test	Till Jun	Shipping cost Plus Insurance fee	Agree Our polity	Nothing
Group-b	Not agree	Ditto	Till Dec	Ditto	Nothing	Nothing

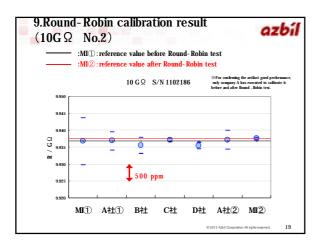












10.schedule	azbil
T 2011/12 2012/04 2012/04 2012/06 2012/06 2012/06 2012/08 2012/09 2012/09 2012/09 2012/10 2012/11 2012/11 2012/12	関係者への声かけ、MIにて仲介器準備(校正) 第一回会合(巡回方法や簡単なルール決定) aグループの各社、巡回測定 bグループの各社、巡回測定 aグループのデータ持ち寄り確認会合 データ集計 MIにて仲介器の再校正 データ集計 日本NCSLI発表資料作成(関係者に再確認) 第二回会合予定(情報交換が目的) 日本NCSLI発表 他社製品の抵抗器を巡回するための会合
I 2013/04	巡回開始 ・ ・ ・

